

ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОГО СИМПОЗИУМА МЕТРОЛОГОВ
19-20 мая, 2009 г., Москва, ВВЦ, павильон №55

Симпозиум посвящен празднованию 175-летия со дня рождения Д.И. Менделеева

Девиз симпозиума: Метрология в поддержку экономическому развитию

19.05.2009 День первый

Ведущий: *Виктор Юрьевич Иванов* (член-корреспондент Метрологической академии РФ, Заместитель директора по науке ФГУП ВНИИМС)

10.00-10.30 – Регистрация участников. Кофе-брейк

10.30 – Пленарное заседание.

Вступительное слово – «Всемирный день метрологии»

Владимир Михайлович Лахов

к.ф.-м.н., Начальник Управления метрологии Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

10.45-11.05 – Первая поверочная палатка, открытая по инициативе великого русского ученого Д.И. Менделеева

Светлана Ивановна Соловьева

Заместитель Генерального директора ФГУ «Тест – Санкт-Петербург»

11.05-11.25 – Система стандартизации, сертификации и метрологического обеспечения в ГК «Роснано»

Юрий Александрович Торопов

Ведущий специалист по аккредитации испытательных центров, экспертов и метрологическому обеспечению Государственной корпорации «Роснано»

11.25-11.45 – Технология сертификационных испытаний программного обеспечения в ОАО «РЖД»

Александр Иванович Лозинин

Начальник отдела Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте ОАО «НИИАС» (ОАО «РЖД»)

11.45-12.00 – Система метрологического обеспечения ГК «Росатом»

Николай Александрович Обысов

Советник генерального директора, главный метролог Государственной корпорации «Росатом»

12.00-12.30 – Торжественная церемония открытия выставки-конкурса «Метрология-2009» (с участием официальных лиц В.Н. Крутиков, А.В. Наумов, С.В. Стрелов, В.М. Лахов, А.С. Евдокимов)

12.30 – 14.00 Выступления участников выставки:

12.30-12.45 Перспективы развития аналитического приборостроения для нанотехнологий в России

Виктор Александрович Быков

Генеральный директор ЗАО «Нанотехнология – МДТ»

12.45-13.00 Современное метрологическое оборудование, обеспечивающее единство измерений

Андрей Александрович Игнашин

Ведущий специалист ЗАО «Теккноу»

13.00-13.15 Вопросы улучшения качества весоизмерений и их поверки

Юрий Николаевич Новиков

Заместитель директора Информационно-технического центра «Сарториус» в Москве – ООО «Сарторос»

13.15-13.30 Калибровочное оборудование АРТВИК: уникальные особенности и новые продукты

Владимир Алексеевич Бакастов

Главный инженер ООО «Артвик Р» (Головное отделение по странам СНГ и Балтии Artvik, Inc.)

13.30-13.45 Новинки и комплексные решения задач метрологического обеспечения

Леонид Иосифович Боришпольский

Директор по метрологическому оборудованию ЗАО ПГ «Метран»

13.45-14.00 Развитие эталонной базы машиностроительного комплекса – проблема системного подхода

Максим Зеленин

Руководитель направления ООО «ХК «Интра Тул»

14.00-15.00 – Перерыв. Кофе-брейк

15.00-15.20 – Тема «Метрологическое обеспечение измерений в медицине»

Наталья Павловна Муравская

к.т.н, Заместитель директора ФГУП ВНИИОФИ

15.20-15.40 – Лабораторные Информационные Менеджемент-Системы (ЛИМС) – Laboratory Information Management Systems (LIMS)

Зайцева Татьяна Михайловна

Главный специалист отдела метрологии ФГУП ВНИЦСМВ

15.40-16.00 Фундаментальная теория избыточных измерений

Владислав Тимофеевич Кондратов

д.т.н., Ведущий научный сотрудник Института кибернетики им. В.М.Глушкова НАН Украины

16.00-16.10 – Подведение итогов 1-го дня работы Симпозиума

Виктор Юрьевич Иванов

член-корреспондент Метрологической академии РФ, Заместитель директора по науке ФГУП ВНИИМС

20.05.2009 День второй

Ведущий: *Виктор Юрьевич Иванов* (член-корреспондент Метрологической академии РФ, Заместитель директора по науке ФГУП ВНИИМС)

10.00-10.30 – Регистрация участников. Кофе-брейк

10.30-10.50 – Пленарное заседание.

Вступительное слово – «Всемирный день метрологии»

Владимир Михайлович Лахов

к.ф.-м.н., Начальник Управления метрологии Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

10.50-11.10 – Состояние и перспективы развития Российской системы измерений

Владимир Михайлович Лахов

к.ф.-м.н., Начальник Управления метрологии Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

11.10-11.30 – Международная Договорённость 1999 г. – путь к взаимному признанию результатов измерений

Лев Константинович Исаев

Проф, д.т.н., член МКМВ, член МКЗМ, зам.директора ФГУП ВНИИМС

11.30-11.50 – Д.И.Менделеев – великий русский ученый - энциклопедист

Светлана Ивановна Соловьева

Заместитель Генерального директора ФГУ «Тест – Санкт-Петербург»

12.50-12.10 – Пути развития и продвижения метрологического обеспечения в космической индустрии

Владимир Владимирович Лукьянчик

к.т.н., Заместитель директора по качеству и сертификации ФГУП НПО «Техномаш» (Федеральное космическое агентство (РосКосмос))

12.10-12.30 – Измерительные потребности и возможности российской nanoиндустрии

Вячеслав Александрович Демин

Гл.специалист агентства по нанотехнологиям и наноматериалам Российского научного центра «Курчатовский институт» (Федеральное агентство по науке и инновациям (РосНаука))

12.30-12.50 – Нанотехнологии, нанометрология и стандартизация

Павел Андреевич Тодуа

Проф., д.ф.-м.н, Генеральный директор ОАО НИЦПВ

12.50-13.10 – Метрология в Белоруссии: состояние и перспективы развития

Сергей Николаевич Нефедов

Начальник управления метрологии Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь (Госстандарт Белоруссии)

13.10-13.30 – Тема «Разработка вопросов информационного обеспечения периодических натурных динамических испытаний ответственных объектов инфраструктуры в эксплуатации»

Крючков Владимир Андреевич

д.т.н, Председатель научного общества МГТУ им.Н.Э.Баумана

13.30-13.45 – Тема «Евро-Азиатское сотрудничество государственных метрологических учреждений СООМЕТ»

Наталья Павловна Муравская

к.т.н, Заместитель директора ФГУП ВНИИОФИ

13.45-14.00 – Состояние и развитие работ по обеспечению единства измерений в области обороны и безопасности государства

Владимир Владимирович Швыдун

к.т.н., полковник, ВРИО Заместителя начальника института по научной работе 32 ГНИИИ МО РФ

14.00-14.45 Перерыв. Кофе-брейк

14.45-15.05 – Точность – рождает качество

Александр Степанович Евдокимов

к.т.н., Заместитель генерального директора ФГУ «Ростест-Москва»

15.05-15.20 – Опыт вступления ассоциации «Аналитика» в мировую систему аккредитации

Иван Владимирович Болдырев

Исполнительный директор Ассоциации аналитических центров «Аналитика»

15.20-15.40 – Метрологическое обеспечение координатно-временных измерений

Петр Александрович Красовский

д.э.н, Генеральный директор ФГУП ВНИИФТРИ

15.40–16.00 Новая стратегия развития теории метрологической надежности

Владислав Тимофеевич Кондратов

д.т.н., Ведущий научный сотрудник Института кибернетики им. В.М.Глушкова НАПН Украины

16.00-16.10 – Подведение итогов работы первого Всероссийского симпозиума метрологов

Владимир Михайлович Лахов

к.ф-м.н., Начальник Управления метрологии Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

16.10-18.00 – Круглые столы. Кофе-брейк